

	装置名	品名	機器利用	技術代行
1	X線光電子分光分析装置	アルバック・ファイ社製 ESCA 5800	2200	24000/件
2	動的二次イオン質量分析測定装置	Analysetechnik GmbH社製ATOMIKA SIMS 4000	1500	3900
3	表面・界面分子振動解析装置	東京インスツルメンツ社製Spectra-Physics	1400	4500
4	高速レーザーラマン顕微鏡	ナノフォトン Raman-touc	2000	4900
5	レーザーラマン分光光度計 NRS-2000	日本分光社製NRS-2000	3300	
6	プローブ型顕微ラマン分光測定装置	カイザーオプティカルシステムズ製RAMAN RXN Systems	1600	4600
7	レーザーラマン分光光度計 NRS-3100	日本分光社製 NRS-3100KK	2300	4900
8	UV-Vis-NIR分光光度計	島津製作所社製SolidSpec-3700DUV	600	3600
9	紫外可視近赤外分光測定装置	日本分光社製V-670	1500	4400
10	超高速HPLC分離・分子構造分析システム	島津製作所maxeraX2、Bruker micrOTOF-QIII、北斗電工 HX-5000、大塚電子 DLS-8000DL)	1900	4800
11	近赤外蛍光分光装置 Fluorolog-NIR	堀場製作所社製 Fluorolog-NIR	1500	4100
12	近赤外蛍光分光装置 NanoLOG-EXT	堀場JOBIN YVON社製NanoLOG-EXT	1000	4000
13	シングルフォトンカウンティング蛍光寿命計測装置	浜松ホトニクス社製	1200	4100
14	核磁気共鳴測定装置	Bruker社製 Avance 500MHz	940	1500/件
15	質量分析装置	JEOL社製 JMS-T100CS	680	2700
16	MALDI-TOF質量分析装置	BRUKER社製 Autoflex III	1700	4500
17	分離用小型超遠心機	日立工機社製CS100GXL	330	3300
18	分取HPLCシステム	日本分析工業社製LC-908-C60	4200	7200
19	走査型プローブ顕微鏡 PicoPlus 5500	アジレントテクノロジー社製 PicoPlus 5500	570	3200
20	表面抵抗率計	三菱化学社製 Loresta-GP	830	3800
21	表面形状測定装置	Veeco社製Dektak 6M	750	3200
22	走査型プローブ顕微鏡 SPM9600	島津製作所社製SPM9600	1200	4100
23	走査型プローブ顕微鏡測定システム	Veeco社製nanoscopeIIIa	2500	5400
24	環境制御型ユニット付き多機能走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー社製SPA300HV	820	3300
25	環境制御型多機能走査プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー社製SPI3800N	380	3500
26	走査型プローブ顕微鏡測定システム	Veeco社製nanoscopeIIIa	2500	5400
27	超高分解能走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ SU9000	1500	4500
28	・3次元SEM画像測定解析システム	KEYENCE VE-9800	1100	4000
29	走査型電子顕微鏡 S-5000	日立社製 S-5000	1900	4500
30	透過型電子顕微鏡システム	日本電子社製 JEM-2010	880	3800
31	ゼータ電位/粒径測定システム	大塚電子ELS-Z	1100	4100
32	ゼータサイザーゼータ電位・粒子径・分子量測定装置	マルバーン社製Nano ZS	2200	6200
33	動的光散乱測定装置	Malvern社製 Zetasizer Nano ZS	960	4000
34	全自動水平型多目的X線回折装置	リガク社製SmartLab	2300	5200
35	単結晶X線構造解析装置	Bruker社製 SMART APEX	3200	36000/件
36	マイクロカロリーメーター	MicroCal社 VP-ITC	2500	5400
37	蒸気圧式絶対分子量測定装置	Gonotec社製 OSMOMAT 070	260	2900
38	蒸気圧式分子量測定装置	KNAUER社製Vapor Pressure Osmometer K-7000	260	3400
39	分子構造解析システム	量子化学計算	320	3300